

Microstructural Analysis of IGZO Thin Films and Its Thin-Film Transistor Application

エムデイ, ローフ, ウル, カリム, カン

<https://hdl.handle.net/2324/4784650>

出版情報 : Kyushu University, 2021, 博士 (学術), 課程博士
バージョン :
権利関係 :

氏 名	MD RAUF UL KARIM KHAN
論 文 名	Microstructural Analysis of IGZO Thin Films and Its Thin-Film Transistor Application (IGZO 薄膜の微細構造解析とその薄膜トランジスタへの応用)
論文調査委員	主 査 九州大学 教授 吉武 剛 副 査 九州大学 教授 服部 励治 副 査 九州大学 准教授 佐道 泰造

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本論文は、インジウムガリウム亜鉛酸化物薄膜の熱伝導特性から結晶性を明らかにし、薄膜トランジスタ応用に向けて Cu ソース/ドレインをもつ新規の作製プロセスを開発したもので電子デバイス工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士（学術）の学位に値するものと認める。